支持脂質二重膜への誘電体バリア放電処理による表面構造変化の観察

Observation of structural changes by dielectric barrier discharge irradiation

[•]湯佐 洸太¹、須田 善行¹、山下 龍舞¹、滝川 浩史¹、針谷 達¹手老 龍吾^{2,3}

(1. 豊技大電気・電子情報、2 豊技大環境・生命、3. 豊技大 EIIRIS)

^oKota Yusa¹, Yoshiyuki Suda¹, Ryuma Yamashita¹, Hirofumi Takikawa¹, Ryugo Tero^{2,3}

(1. Dept. of Electrical and Electronic Information Eng., 2. Dept. of Environmental of Life Science,

3.EIIRIS, Toyohashi Univ. Technol.)

E-mail: kota.yusa@pes.ee.tut.ac.jp

http://arc.ee.tut.ac.jp/enedev/

1. はじめに

筆者らは誘電体バリア放電(DBD)処理した支持脂 質二重膜(SLB)の挙動を調査してきた。これまでに、 Ar ガスを用いて DBD処理した SLB にナノメートルサ イズおよびマイクロメートルサイズの孔が空くことを 明らかにした^{(1),(2)}。また、プラズマ照射時間を調整する ことで、SLB に孔が形成される前の過程が存在するこ とを示した⁽¹⁾。その後、プラズマ電力の効率性から、He ガスを用い、先述の孔形成前の過程に注目し、SLB を DBD処理した。そして、構成する脂質分子の拡散係数 が照射後に低下する、という結果を報告した⁽³⁾⁽⁴⁾。今回 は、SLB への He ガスを用いた DBD 処理による表面構 造の変化を知るために、蛍光顕微鏡を用いて SLB に形 成された孔の面積率の投入電力量依存性を調査した。

2. 実験条件

DBD 装置のギャップ長は 1.5 mm とし、装置全体を グローブボックスで囲い,ガス置換できるようにした。 He ガスを流量 5 NL/min で 5 min 流し、周波数 15 kHz の高周波電圧を電極間に印加した。電圧電源は玉置電 子製 TE-HFV 1530K-0400 を用いた。下部石英板に設け た深さ 2.0 mm のくぼみ中に、ベシクル融合法を用い て SiO₂/Si 基板上に SLB を作製した。脂質として DOPC (dioleoylphosphatidylcholine)、蛍光色素ラベル脂質と して Rb-DOPE (rhodamine B-dioleoylphosphatidylethanolamine,)を使用し、ベシクル懸濁液中の濃度は 0.1 mM DOPC/Rb-DOPE(1:2*10⁻³) とした。SLB への DBD の 投入電力量は V-Q リサジュー図を使用し、求めた。落 射蛍光顕微鏡で処理前後の SLB を観察し、処理後の SLB に形成された孔の面積率は画像解析ソフト ImageJ を使用し求めた。

3. 実験結果

図1にDBDの投入電力量を変化させたときのSLBの 蛍光顕微鏡像を示す。図1において、投入電力量(c)8.2 kW・s時より極小密度の孔が観察され、(d)11.5 kW・s 時以降、孔の密度は大幅に増加した。図2に、プラズ マ照射時間に対する孔の面積率を示す。図2に示すプ ロットは、各投入電力量で処理したSLBの蛍光像をそ れぞれ無作為に10点以上選び、各画像における孔の 面積率の平均値を示したものである。図2において投 入電力量の増加に伴い、孔の面積率は増加し、8.2 kW・ s時における孔の面積率は θ pore=0.02%、20.9 kW・s時 には θ pore=2.3%となった。このことから、SLB は DBD 照射によって、その拡散性に影響が現れた後に、孔形 成へと進行することが明らかとなった。詳しくは当日 報告する。また、現在我々は DOPC-SLB にコレステロ ールを投入した2成分系への DBD 照射実験も行って いる。この結果の詳細についても当日報告する。



図 1 (a) プラズマ照射前,投入電力量(b)4.1 kW・s,(c) 8.2 kW・s,(d)11.5 kW・s,(e)20.9 kW・s で照射した 後の DOPC-SLB の蛍光顕微鏡画像



図2 蛍光顕微鏡像より求めた孔の面積率 θ pore の 投入電力量依存性

謝辞

本研究の一部は,豊橋技術科学大学 EIIRIS プロジェ クト, JSPS 科研費 24360108,25630110,15H00893 を受 けて行なわれた。

文献

- (1) R. Tero, et al: Applied Physics Express, Vol. 7, 077001 (2014)
- (2) R. Kato, et al: 12th International Conference on Atomically Controlled Surfaces, Interfaces and Nanostructures, 8PN-6, (2013.11.4-8)
- (3) Y. Suda, et al: Jpn. J. Appl. Phys., in press
- (4) 山下,他,第62回応用物理学会春季学術講演会,13a-A28-10, (2015.3.11-14)
- (5) L. Cwiklik and P. Jungwirth, Chem. Phys. Lett., 486 99 (2010)